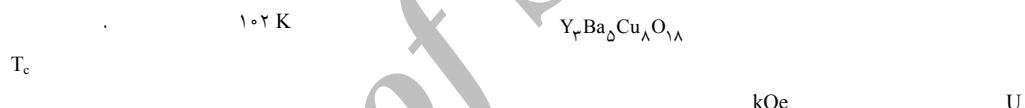




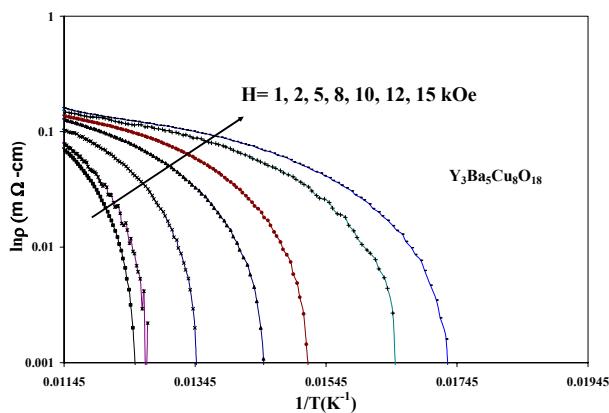
(MRL)

aliabadi@physics.sharif.edu :



زیر دمای گذار ابررساناگی دمای بالا در حضور میدان‌های مغناطیسی مدل‌های مختلفی ارائه شده است و دینامیک شار در آنها بررسی شده است. مدل‌های خرزش شار، شارش شار و لغزش فاز که ناشی از افت و خیز در پارامتر نظم ابررساناگی است، مدل‌های هستند که برای توضیح پهن شدگی گذار مقاومت ویژه در حضور میدان مغناطیسی در ابررساناگی دمای بالا به کار گرفته می‌شود. استفاده از مدل آمبگوکار-هالپرین (AH) در بعضی از ابررساناگاهی دمای بالا برازش خوبی داشته است [۵]، در برخی از گزارشات در ناحیه نزدیک ($T=0\text{ K}$) از انحراف از مدل AH مشاهده می‌شود [۶]. در این ناحیه مدل خرزش شار فعال شده گرمایی (TAFC) بهتر جواب می‌دهد. در این مقاله ما به بررسی خواص مغناطیسی و دینامیک شار در این ترکیب از خانواده YBCO بر اساس مدل خرزش شار فعال شده گرمایی می‌پردازیم.

در سال ۱۹۸۷ ترکیبی از خانواده $YBa_2Cu_3O_7$ ، YBCO (Y₁₂₃) با دمای گذار 92 K ، بالای دمای نیتروژن مایع، کشف شد که این ترکیب شامل صفحات اکسید مسی بود [۱]. یک سال بعد از کشف Y₁₂₃، دو ترکیب دیگر از این خانواده با استوکیومتری Y₁₂₄ و Y₂₂₄₇ کشف شدند که دمای گذاری به ترتیب 80 K و 40 K برای آنها گزارش شد [۲ و ۳]. اخیراً در آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیسی دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف ترکیبی از این خانواده با استوکیومتری $Y_3Ba_5Cu_8O_{18}$ (Y₃₅₈) ساخته شد که افزایش دمای گذاری بیشتر از 10 K نسبت به ترکیب Y₁₂₃ در آن مشاهده شده است [۴]. این ترکیب دارای پنج صفحه اکسید مسی CuO_2 و سه زنجیره اکسید مسی CuO در سلول واحد است. در بررسی پهن شدگی ناحیه گذار مقاومت الکتریکی در



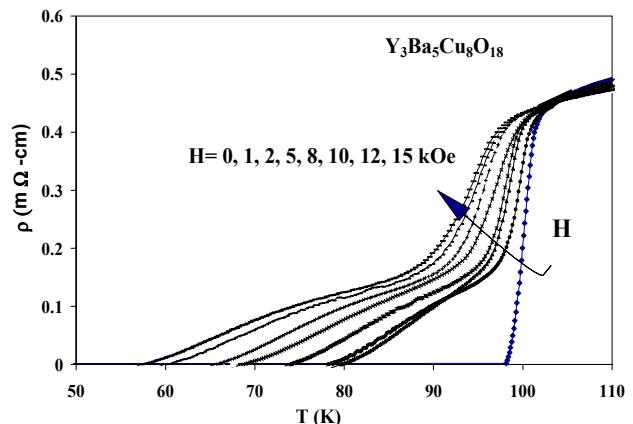
شکل ۲. نمودار $\ln \rho - 1/T$ ترکیب به ازای میدان‌های مغناطیسی مختلف با اتصال نقاط به هم برای راهنمایی چشم.

نمی‌کند. پهن شدگی مربوط به گذار مقاومت ویژه الکتریکی نشان می‌دهد که نمونه از طریق پدیده اتلاف، که توسط شارش گردشاره‌ها به وجود می‌آید، به میدان مغناطیسی خارجی حساس است [۸]. این رفتار به انرژی میخکوبی مربوط است. بر اساس مدل خوش شار فعال شده گرمایی، بین مقاومت ویژه الکتریکی و انرژی میخکوبی رابطه زیر برقرار است [۶]:

$$\rho(H, T) = \rho_0 \exp(-U(H)/k_B T), \quad (1)$$

در رابطه (۱)، ρ مقاومت حالت ب亨جارت است. با فرض فرآیند فعالسازی گرمایی، انرژی میخکوبی U در دماهای پایین با شیب نمودار $\ln \rho - 1/T$ متناظر است. نمودار $\ln \rho - 1/T$ در شکل ۲ برای نمونه $Y_3Ba_5Cu_8O_{18}$ در میدان‌های مغناطیسی مختلف رسم شده است.

شیب قسمت‌های انتهای منحنی‌ها مقدار U/k_B و عرض از مبدأ آن مقدار ρ_0 را نتیجه می‌دهد. ناحیه مربوط به دماهای نزدیک ($T_c = 0$) در اکثر منحنی‌های رسم شده برآش خوبی را با خط ندارند. مقدار ρ_0 به دست آمده از برآش ناحیه تقریباً خطی در منحنی‌های $\ln \rho - 1/T$ از $10^{11} \text{ m}\Omega\text{-cm}$ تا $10^9 \text{ m}\Omega\text{-cm}$ در نمونه $Y_3Ba_5Cu_8O_{18}$ تغییر می‌کند که بسیار بزرگتر از مقاومت حالت ب亨جارت نمونه است. از آنجا که در حالتی که انرژی میخکوبی قابل صرف نظر کردن باشد، باید مقاومت برابر ρ_0 شود و در حدود مقاومت حالت ب亨جارت در نقطه شروع گذار باشد، بنابراین باید وابستگی انرژی فعالسازی به دما را نیز در نظر گرفت.



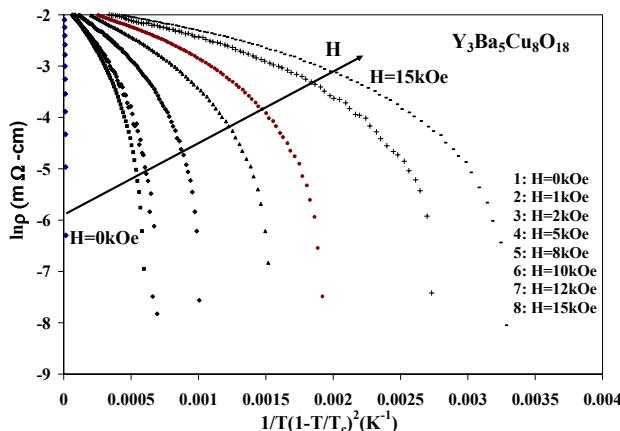
شکل ۱. مقاومت ویژه نمونه در حضور میدان‌های مغناطیسی 15 و 10 و 8 و 5 و 2 و 1 و H .

نمونه $Y_3Ba_5Cu_8O_{18}$ به روش استاندارد حالت جامد، و دمای کلسینه 840°C و دمای کلوخه سازی 92°C ساخته شدند. جزئیات بیشتر در مورد نحوه ساخت مواد و نتایج مقاومت الکتریکی در مراجع [۴ و ۷] آورده شده‌اند.

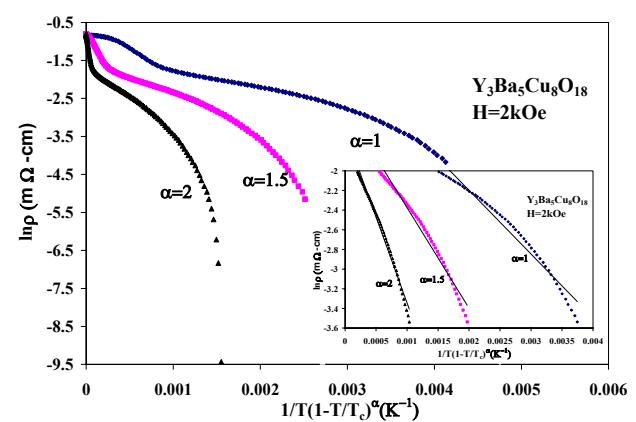
در این تحقیق مقاومت الکتریکی نمونه در حضور میدان‌های ثابت مغناطیسی با مقدادر 15 kOe و 12 و 10 و 8 و 5 و 2 و 1 $H=0$ عمود بر جریان الکتریکی و عمود بر سطح نمونه اندازه‌گیری شد. پهن شدگی در ناحیه زیر دمای گذار تحت میدان‌های مغناطیسی با تصحیح مدل خوش شار فعال شده گرمایی مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج اندازه‌گیری مقاومت ویژه الکتریکی نمونه $Y_3Ba_5Cu_8O_{18}$ در حضور میدان مغناطیسی $H=0$ و 15 kOe به صورت تابعی از دما در شکل ۱ نشان داده شده است.

مقاومت الکتریکی حالت ب亨جارت نمونه با اعمال میدان مغناطیسی تغییری نمی‌کند و تنها ناحیه گذار زیر T_c تحت تأثیر میدان مغناطیسی قرار می‌گیرد. ناحیه گذار با اعمال میدان مغناطیسی پهن شده و $(T_c = 0)$ در جهت دماهای پایین تر کاهش می‌یابد. برای $H=15$ kOe $T_c = 58$ K مشاهده شد، ولی دمای شروع گذار T_{onset} در نمونه تغییر محسوسی



شکل ۴. منحنی $\ln\rho$ بر حسب $1/T(1-T/T_c)^2$ به ازای میدان‌های مغناطیسی مختلف.



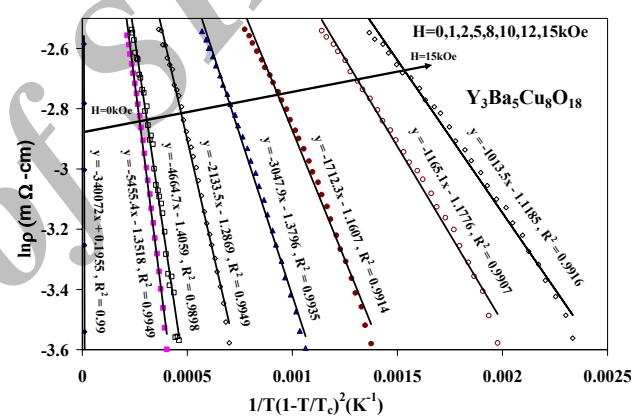
شکل ۳. منحنی $\ln\rho$ بر حسب $1/T(1-T/T_c)^\alpha$ به ازای ۲ و ۱/۵ و ۱ در میدان $H=2$ kOe.

همراه با برازش آن را نشان می‌دهد.

در شکل ۳ برای ترکیب $\text{Y}3\text{O}8$ و میدان مغناطیسی 2 kOe در صد برازش منحنی‌ها با خط در $\alpha=2$ برابر $R^2=0.99$ است و در مقادیر $1/5$ و 1 به ترتیب به 0.97 و 0.96 کاهش می‌یابد. نتایج برازش‌ها نشان داد که $\alpha=2$ برازش مناسب‌تری با منحنی‌ها دارد. در ضمن $\alpha=2$ نشان از دو بعدی بودن سیستم مورد مطالعه است.

در شکل ۴ برای $\text{Y}3\text{O}8$ ، منحنی $\ln\rho-1/T(1-T/T_c)$ در میدان‌های مغناطیسی مختلف رسم شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود با افزایش میدان مغناطیسی شیب منحنی‌ها کاهش می‌یابد که شیب منحنی‌ها معادل انرژی میخکوبی برازش می‌باشد و نتیجه می‌گیریم که انرژی میخکوبی کاهش می‌یابد. خروج شار و عبور از سد پتانسیل مربوط به مراکز میخکوبی، آسان‌تر صورت می‌گیرد و کاهش سد پتانسیل سبب کاهش انرژی فعال‌سازی می‌گردد. در دماهای پایین قسمت خطی منحنی را با خط برازش دادیم و مقادیر عرض از مبدأ و شیب آنها در شکل ۵ آورده شده است. شیب قسمت خطی در ناحیه انتهای منحنی‌ها در شکل ۵ برابر با مقدار $U(H)$ است.

در شکل ۶ تغییرات $U(H)$ بر حسب میدان‌های مغناطیسی $H=0-15$ kOe برای ترکیب $\text{Y}3\text{O}8$ آورده شده است، همان‌گونه



شکل ۵. مقادیر حاصل از برازش خطی منحنی‌های $\ln\rho-1/T(1-T/T_c)$ در میدان‌های مغناطیسی مختلف.

وابستگی انرژی فعال‌سازی U به دما به صورت زیر در نظر

گرفته می‌شود [۹]:

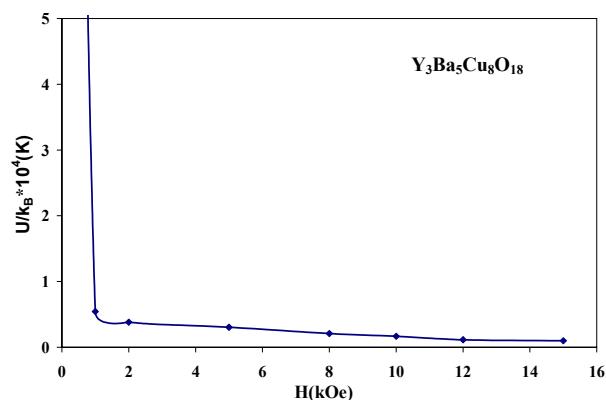
$$U = U(H) \left(1 - \frac{T}{T_c}\right)^\alpha, \quad (2)$$

مقدار α برابر $\alpha=1/5$ ، $\alpha=1$ و $\alpha=2$ در ابرساناهای دمای بالا گزارش شده است [۱۰ تا ۱۲]. به منظور بررسی وابستگی U به دما و پیدا کردن مقدار مناسب α ، منحنی‌های $\ln(\rho)$ بر حسب $1/T(1-T/T_c)^\alpha$ را به ازای مقادیر مختلف α برای ترکیب $\text{Y}3\text{O}8$ در میدان مغناطیسی اعمال شده برابر 2 kOe را در شکل ۳ رسم کردیم. شکل داخلی شکل ۳ ناحیه خطی

(onset) در این ترکیب کاهش می‌یابد، ولی تأثیر میدان مغناطیسی بر روی دمای گذار بین دانه‌ای بیشتر از تأثیر میدان مغناطیسی بر روی دمای گذار درون دانه‌ای است. با تصحیح مدل خوش شار فعال شده گرمایی و دخالت دادن وابستگی دمای انرژی میخکوبی، به ازای $a=2$ بهترین برآش خطی در دماهای نزدیک دمای گذار دیده شد که نشانه‌ای از دو بعدی بودن ترکیب مورد مطالعه است. همچنین دیده شد که انرژی میخکوبی با تغییرات میدان مغناطیسی رفتاری توانی دارد. برای میدان‌های مغناطیسی کوچکتر از ۱ kOe انرژی میخکوبی شدیداً با افزایش میدان کاهش می‌یابد، ولی برای میدان‌های بزرگتر، انرژی میخکوبی با افزایش میدان به طور بسیار آهسته کاهش می‌یابد.

از همکاری‌های سعید فلاحتی، مجتبی مظاہری و حنیف هادی پور نهایت قدردانی را داریم. این پژوهش توسط قطب علمی سیستم‌های پیچیده و ماده چگال دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف (www.cscm.ir) و معاونت پژوهشی و فناوری حمایت شده است.

۷. آذر علی آبادی، یاسمن اخوان، محمد اخوان، نهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز (۱۳۸۷) ۵۹۸.
8. A K Pradhan, Z X Shi, M Tokunaga, T Tamegai, Y Takano, K Togano, H Kito, and H Ihara, *Phys. Rev. B* **64** (2001) 12509.
9. T T M Palstra, B Batlogg, L F Schneemeyer, J V Waszczak, *Phys. Rev. B* **43** (1991) 3756.
10. G Detscher, K A Muller, *Phys. Rev. Lett.* **59** (1987) 1745.
11. M Tinkham, *Phys. Rev. Lett.* **61** (1988) 1658.
12. R Gross, P Chaudhari, D Dimos, A Gupta, G. Koreu, *Phys. Rev. Lett.* **64** (1990) 228.



شکل ۶. انرژی میخکوبی مستقل از دما بر حسب میدان مغناطیسی.

که از شکل مشاهده می‌شود، انرژی میخکوبی با تغییرات میدان مغناطیسی رفتار توانی دارد و نرخ کاهش انرژی میخکوبی با افزایش میدان مغناطیسی در میدان‌های بالا کم شده است. در میدان‌های مغناطیسی کوچکتر از ۱ kOe انرژی میخکوبی شدیداً به میدان مغناطیسی وابسته است ولی برای میدان مغناطیسی بالا این وابستگی بسیار کوچکتر است.

بر اثر حضور میدان مغناطیسی، دمای شروع گذار درون دانه‌ای

1. K Wu, J R Ashburn, C J Torng, P H Hor, R L Meng, L Gao, Z J Huang, Y Q Wang, C W Chu, *Phys. Rev. Lett.* **58** (1987) 908.
2. P Marsh, R M Fleming, M L Mandich, A M De Santolo, J Kwo, M Hong, and L J Martinez-Miranda, *Nature* **336** (1988) 660.
3. P Bordet, C Chaillout, J Chenavas, J L Hodeau, M Marezio, J Karpinski, E Kaldis, *Nature* **334** (1988) 596.
4. A Aliabadi, Y Akhavan Farshchi, M. Akhavan, *Physica C* **469** (2009) 2012.
5. V Ambegaokar, B I Halperin, *Phys. Rev. Lett.* **22** (1969) 1364.
6. H S Gamchi, G J Russell, K N R Taylor, *Phys. Rev. B* **50** (1994) 12950.